

Далер Арабов

I

II

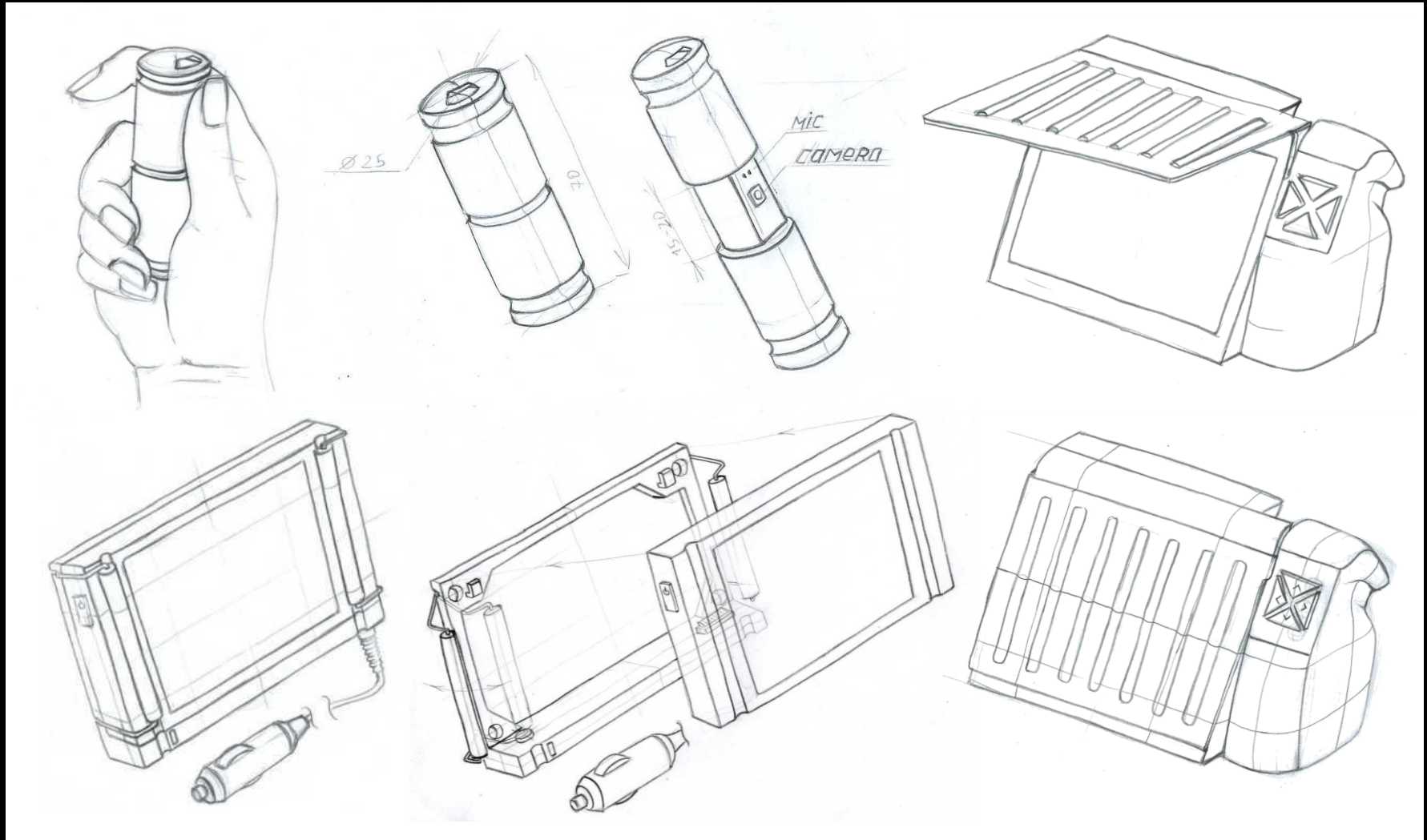
III

IV

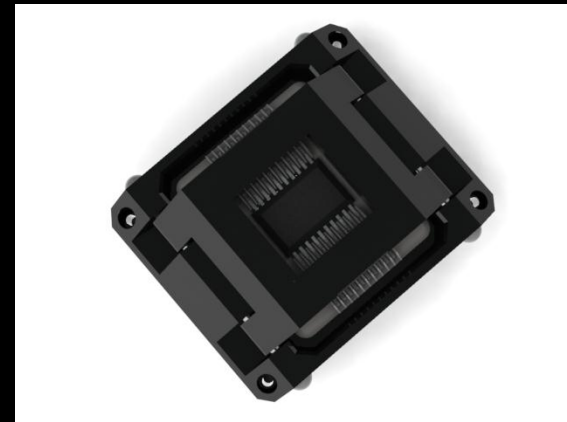
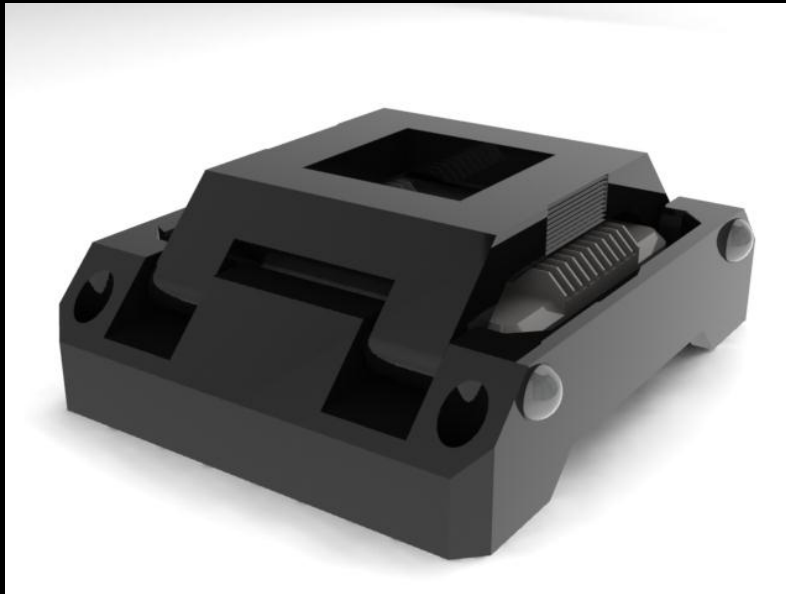
V

Portfolio

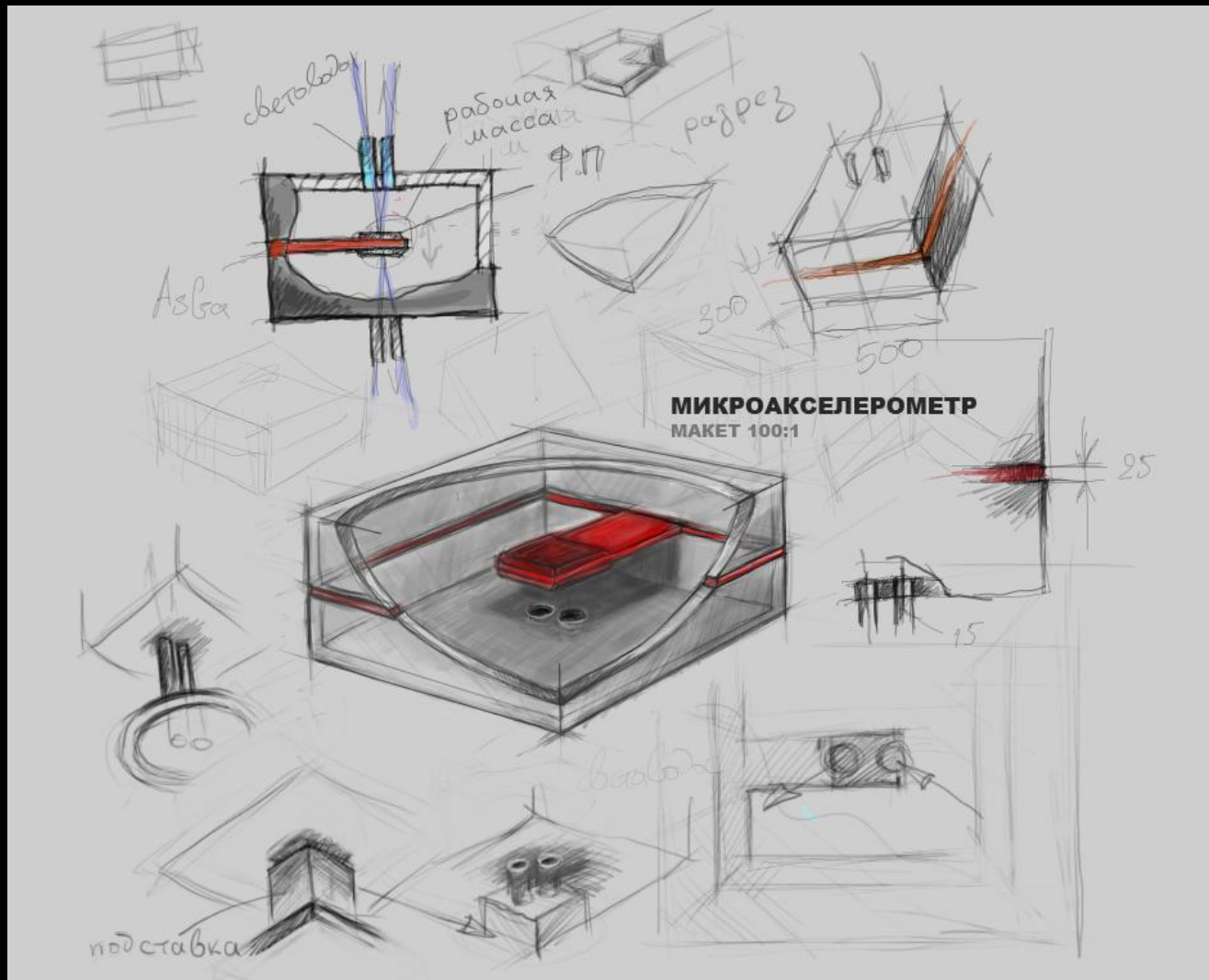
Модельный ряд «Навигатор» систем GPS\ГЛОНАСС



Технологическая оснастка «Контактор»

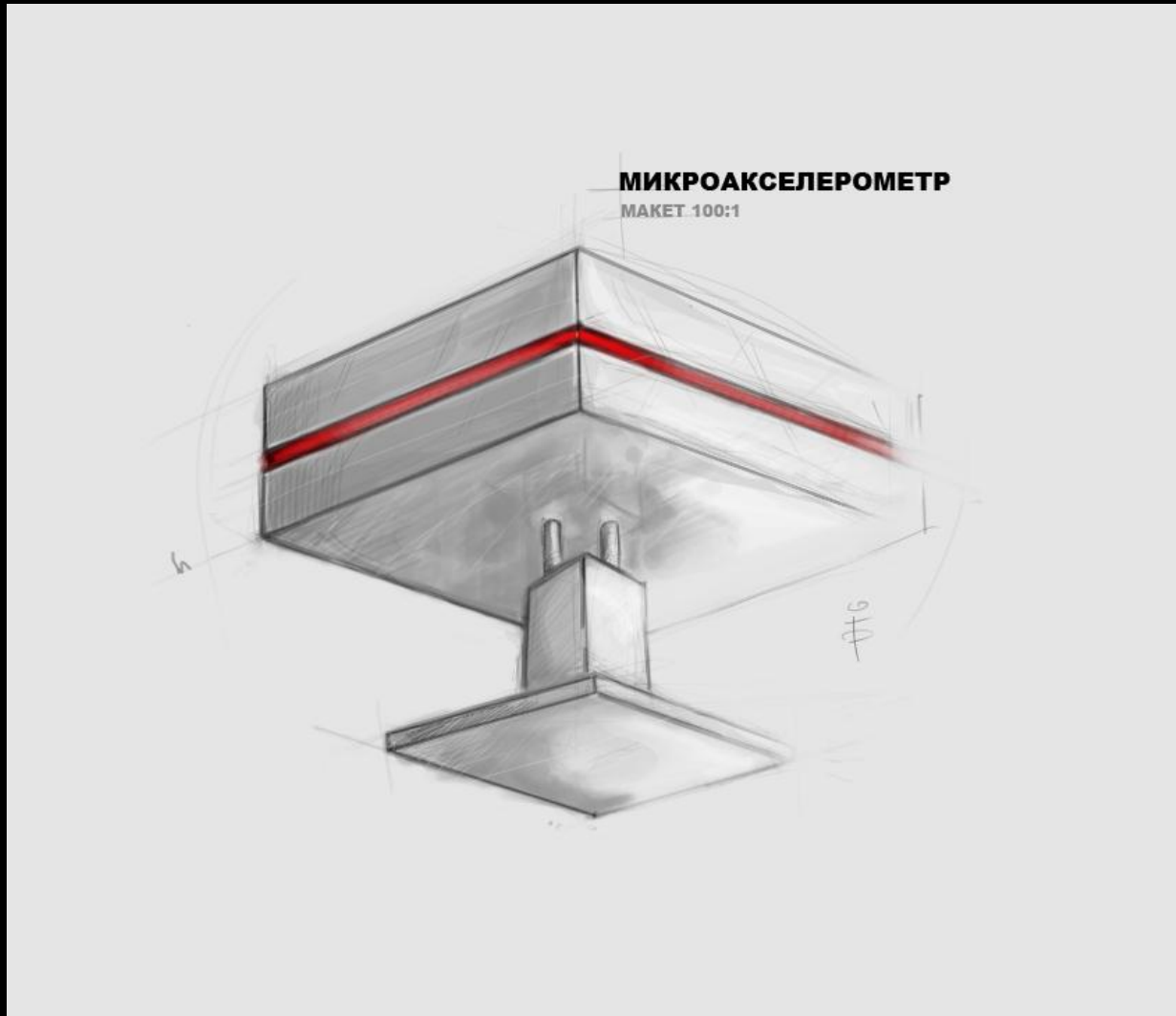


Проектирование масштабного макета микроакселерометра



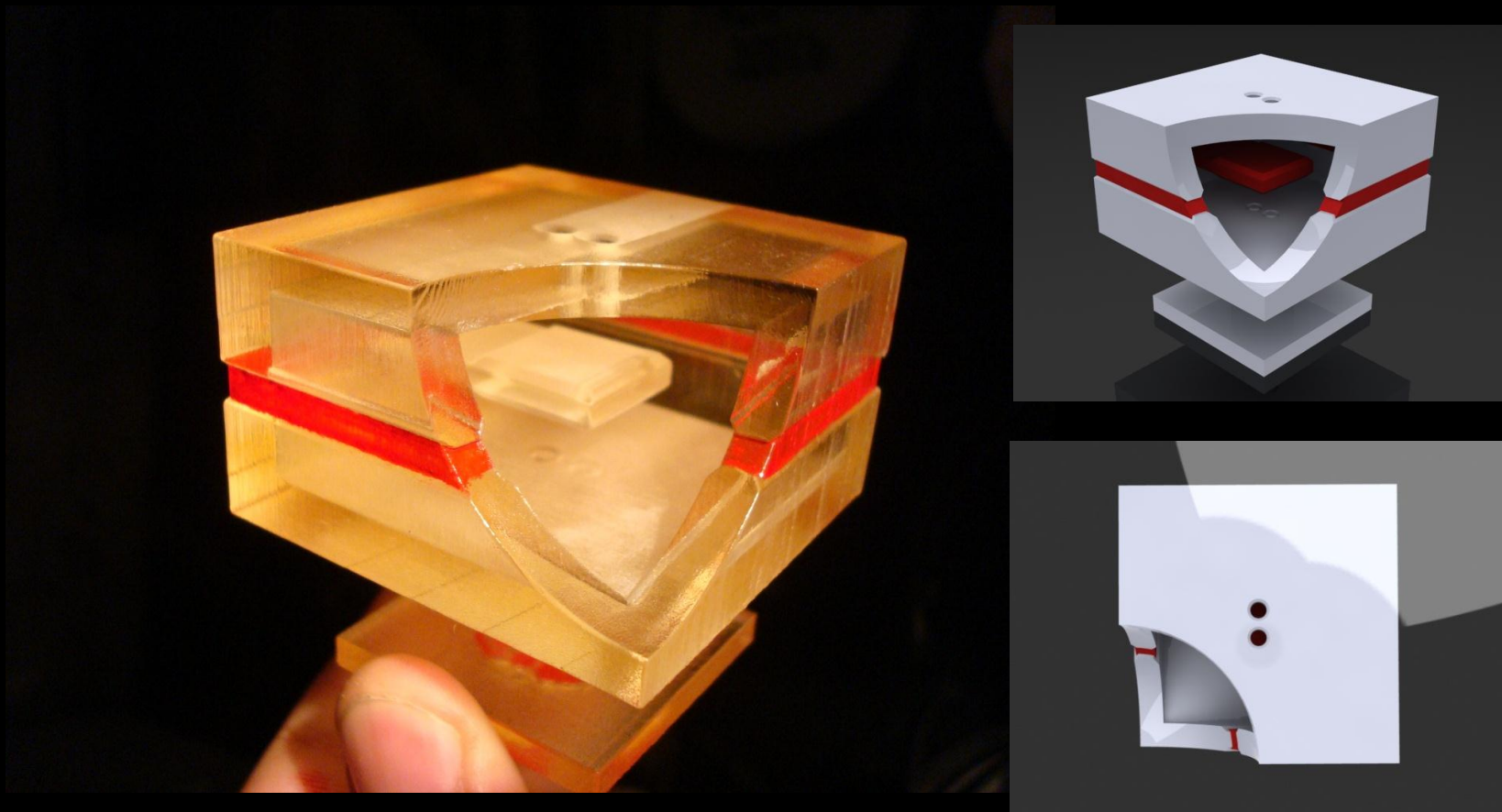
Курсовая научно исследовательская работа. 2008 г.

Проектирование масштабного макета микроакселерометра



Курсовая научно-исследовательская работа. 2008 г.

Проектирование масштабного макета микроакселерометра



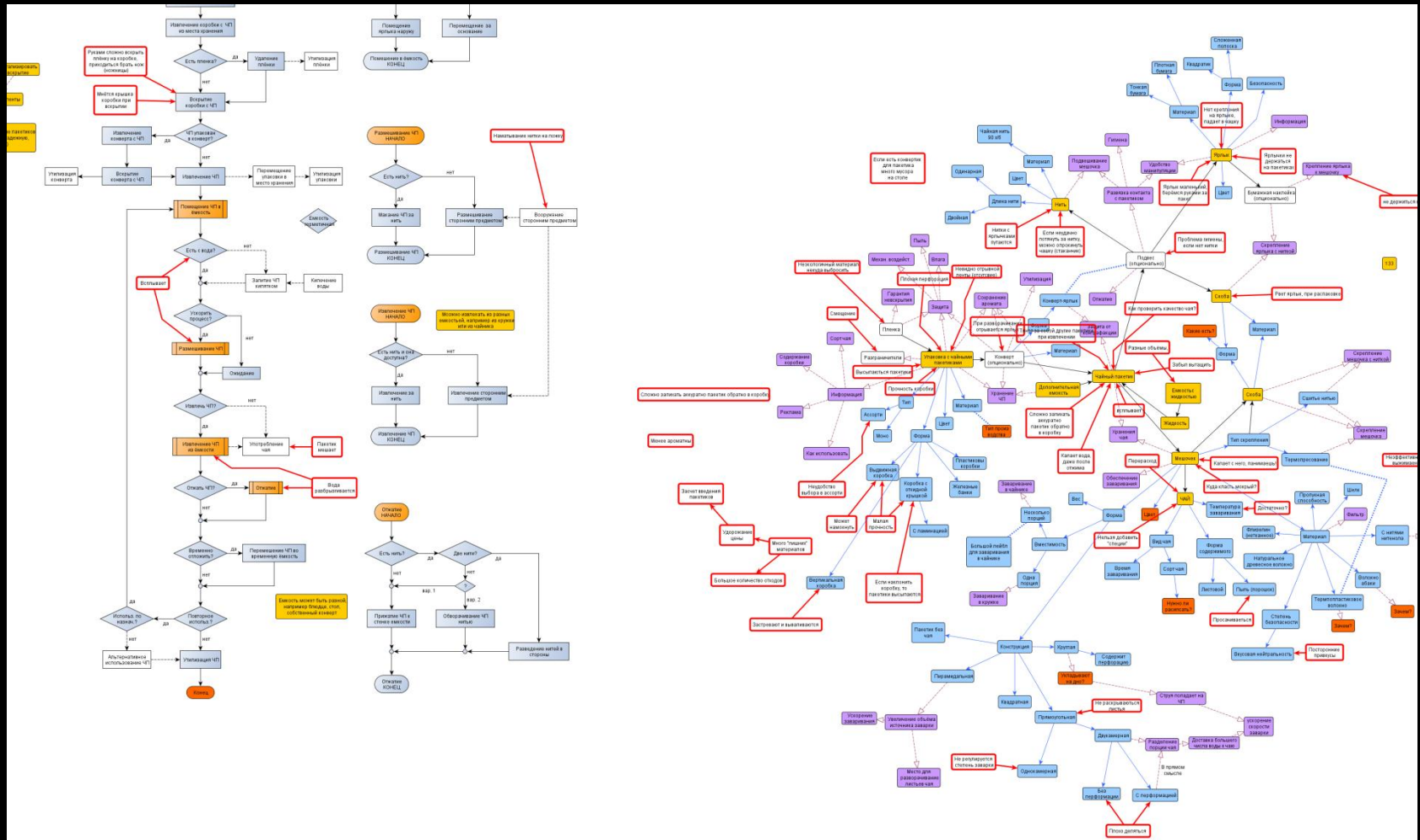
Макет создан по технологии быстрого прототипирования

Дизайн-анализ пользования чайником «Малыш»



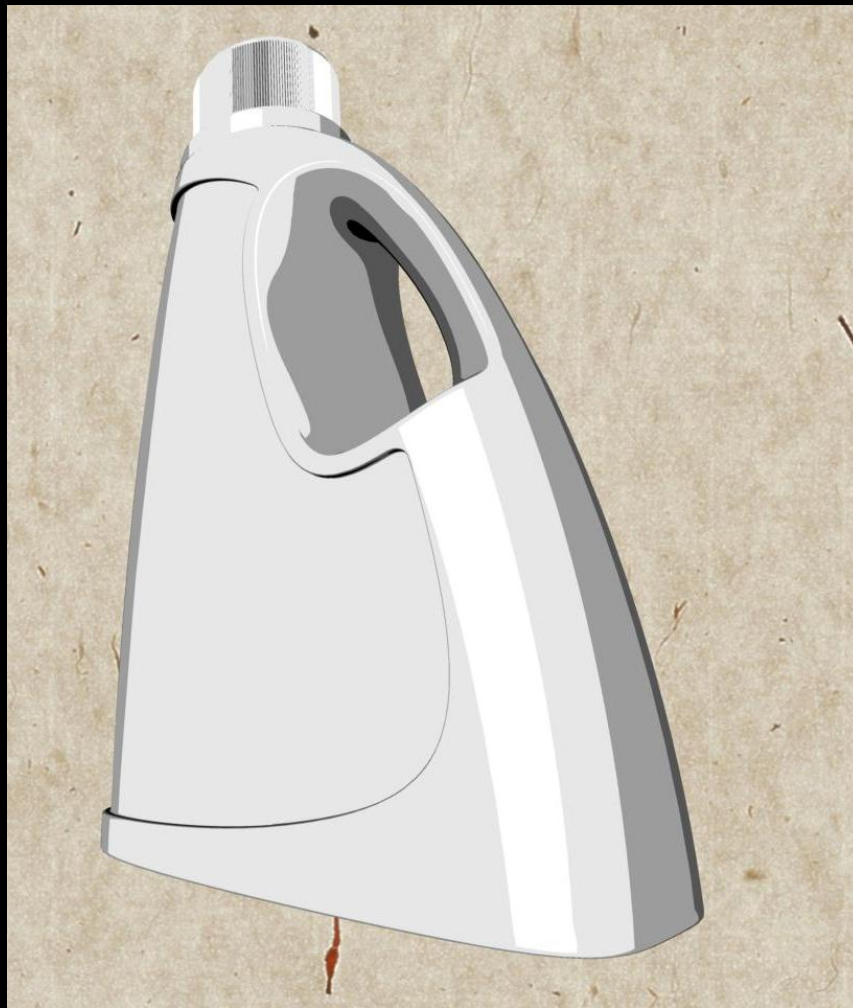
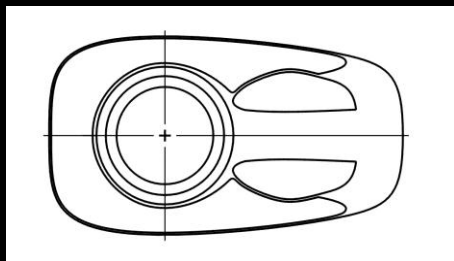
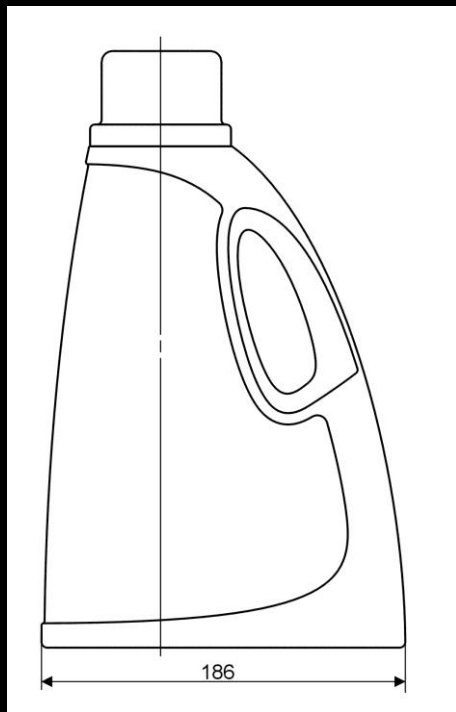
Визуализация прямого наблюдения пользования

Дизайн-анализ пользования чайного пакетика



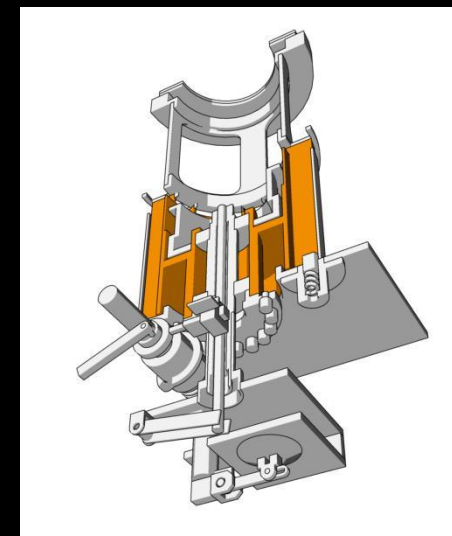
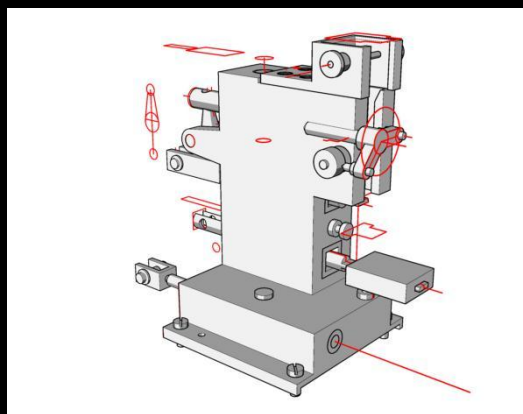
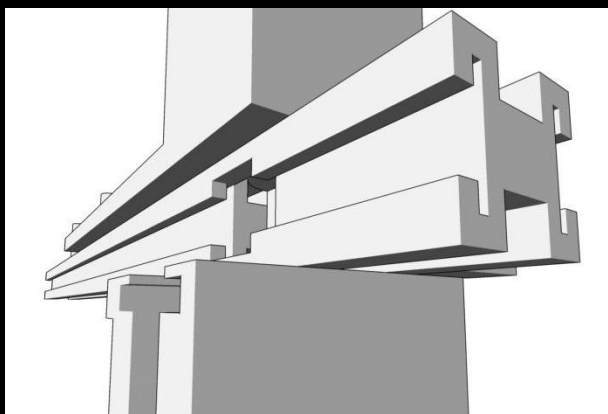
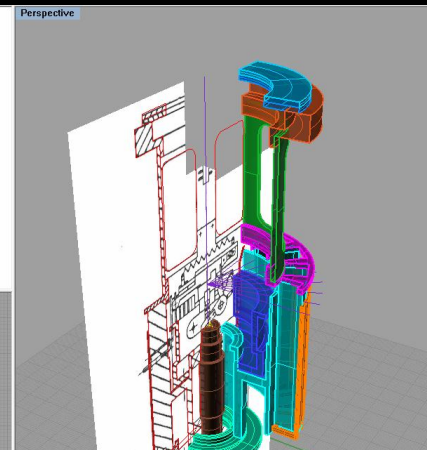
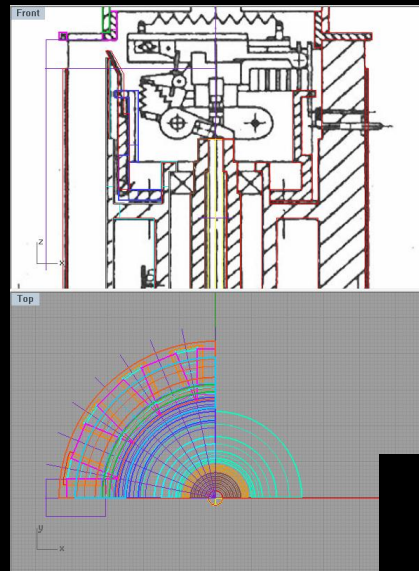
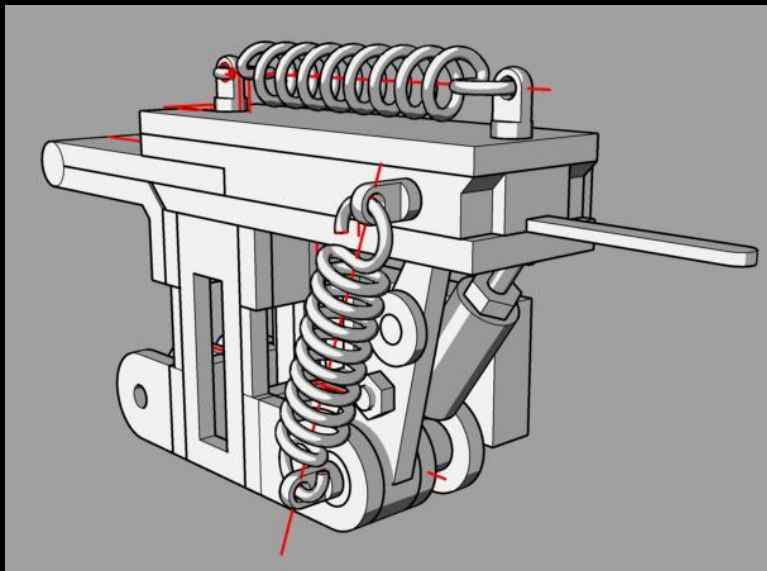
Выявление проблем пользования

Концептуальное проектирование



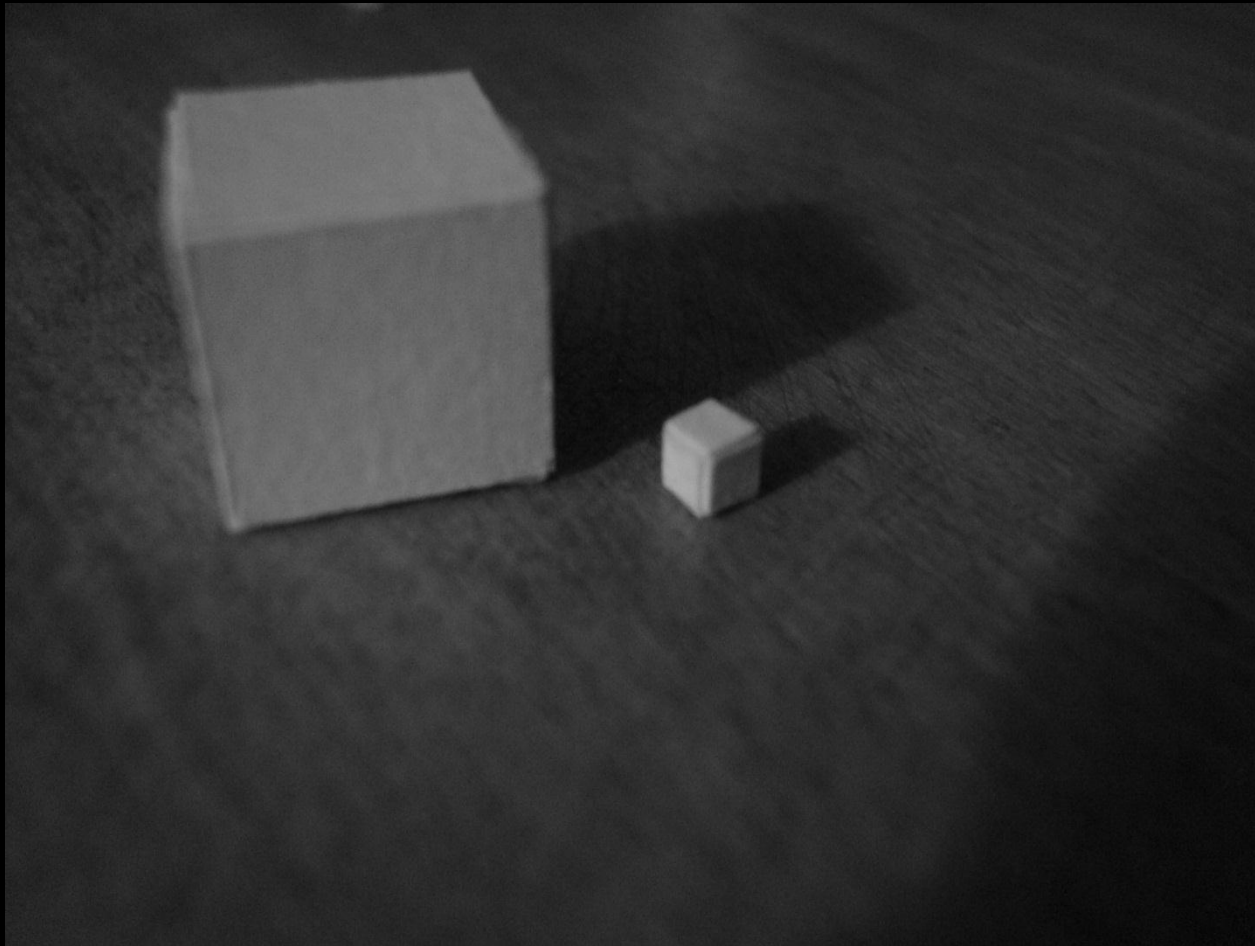
Построение 3D-модели канистры

Проектирование роботизированных комплексов



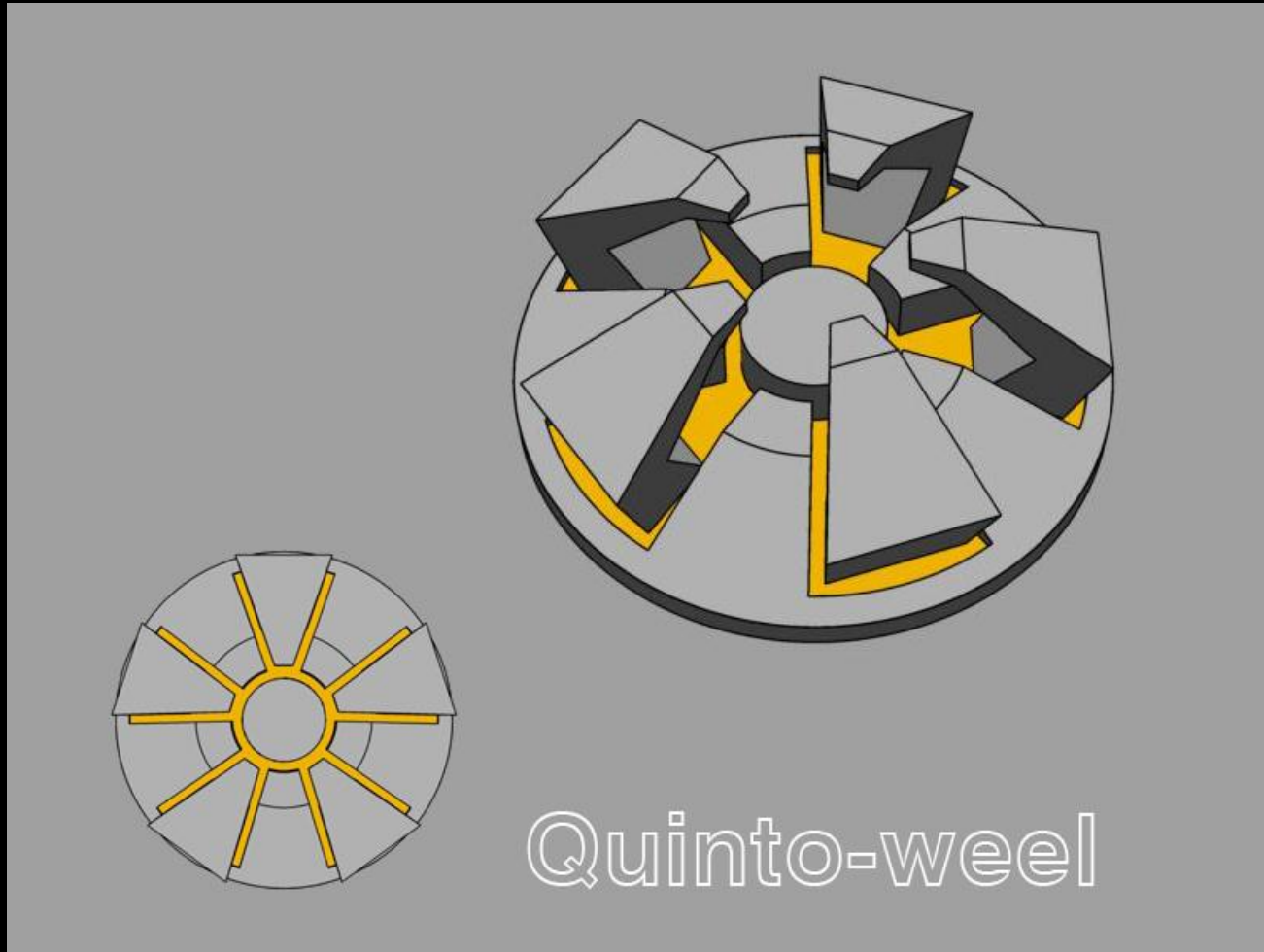
Визуализация элементов технологической оснастки

Макетирование



Бумажные кубы 10x10x10 мм (слева) и 1x1x1 мм (справа)

Композиция



Пространственная композиция с осевой симметрией

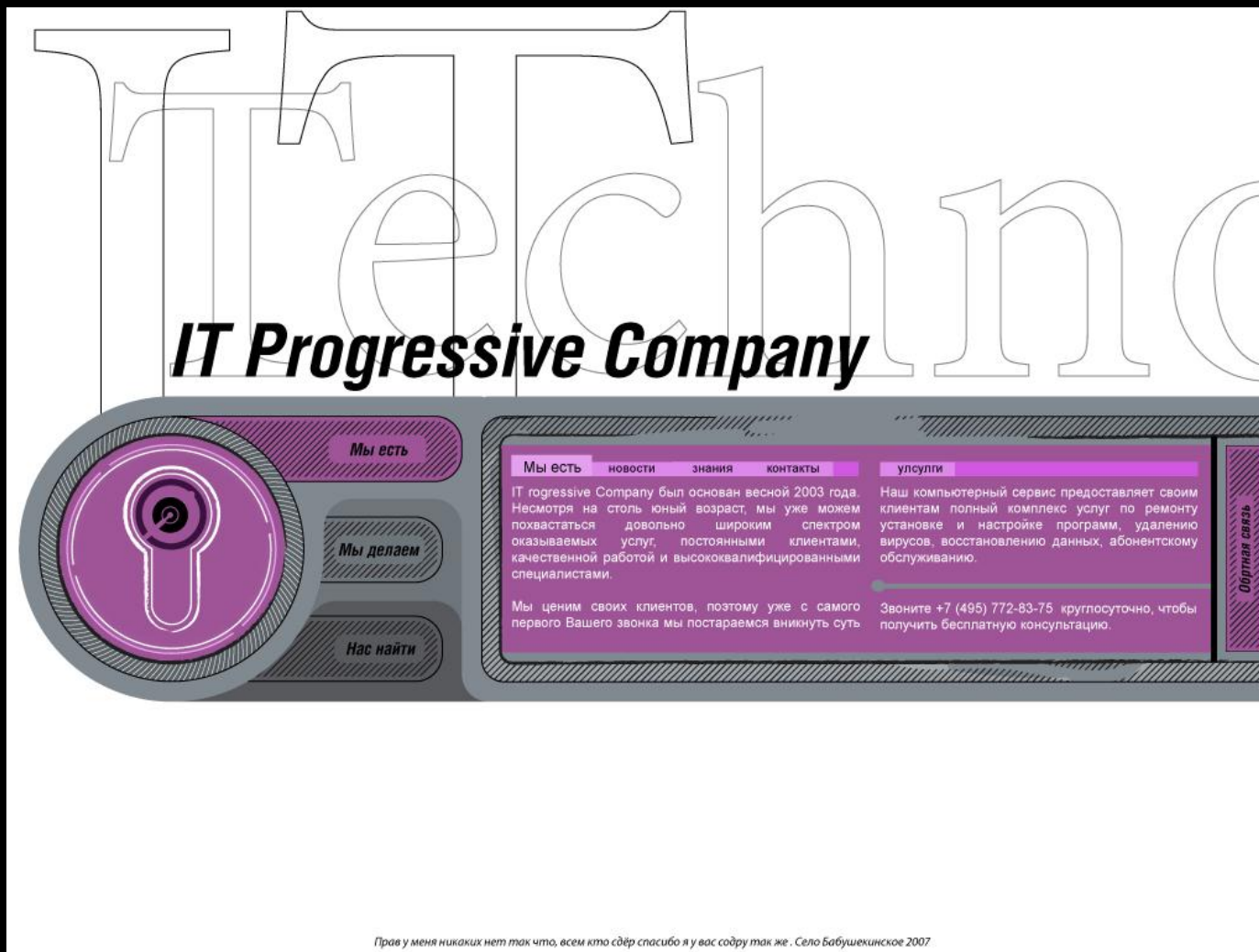
Концепция сайта магазина сувениров



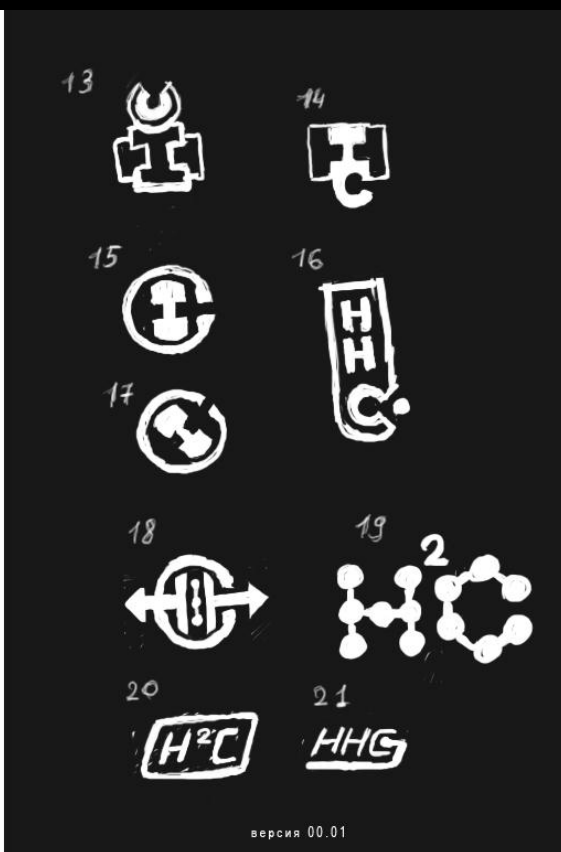
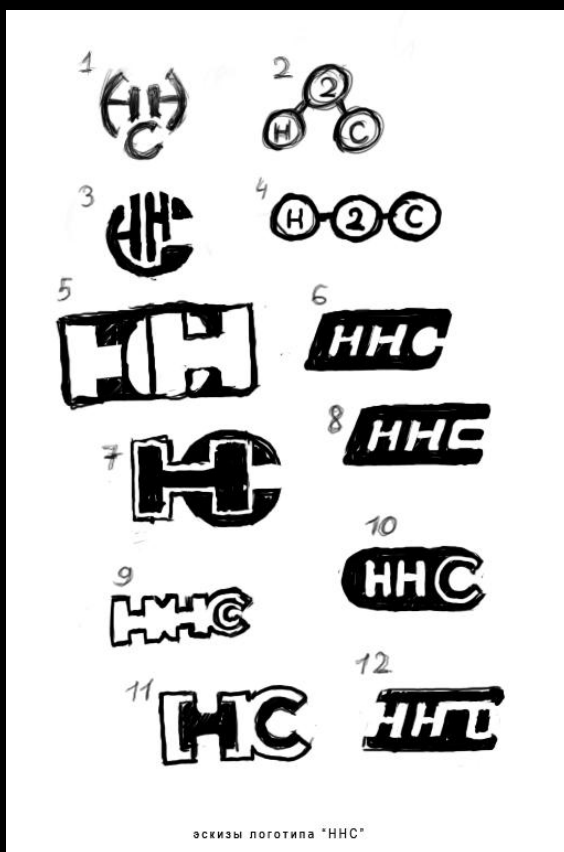
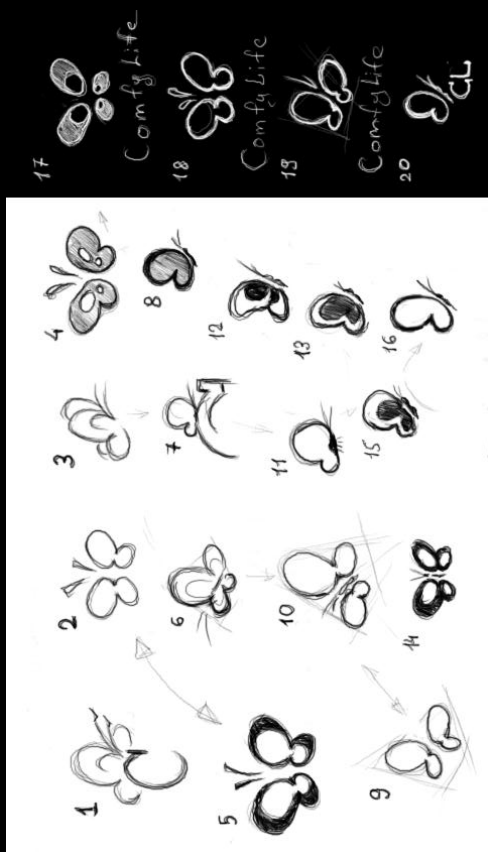
Концепция сайта IT-компании



Концепция сайта IT-компании



Логотипы организаций



Логотипы организаций



Реклама спортклуба «Катана-кай»

Спортивный клуб МГТУ им. Баумана школы "КАТАНА-КАЙ" отделения всестилевого контактного каратэ приглашает студентов в группы:

вт. чт. 18⁰⁰ - 20⁰⁰ сборные команды
вт. чт. 16⁰⁰ - 17⁰⁰ детская группа
вт. чт. 14⁰⁵ - 15³⁵ новички
вт. чт. 17⁴⁵ - 19¹⁵ сборные команды

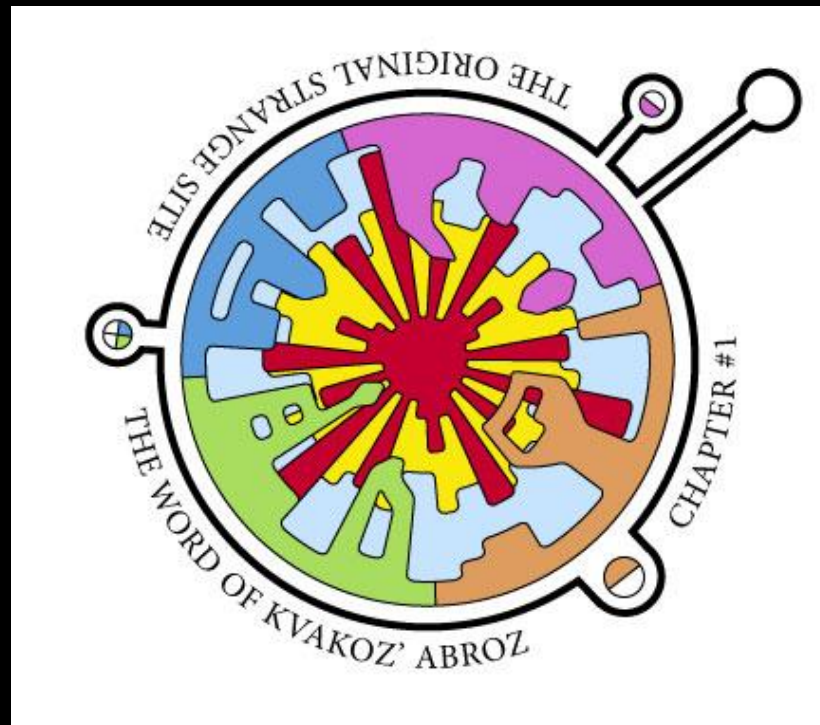
Катанский С.А. грандмастер
Филипока Ю.В. V dan
Филипока Ю.В. V dan
Филипока Ю.В. V dan

КАТАНА КАЙ



«Подлинное изучение воинских искусств подразумевает упорное постижение искусства жизни.» Три Тхонг Данг

Плакаты

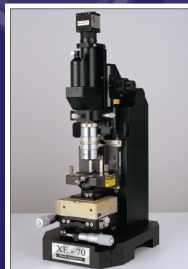


Инфографический плакат



КЛАССИФИКАЦИЯ СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОСКОПИИ

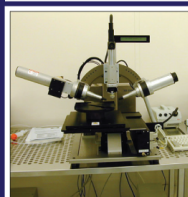
Типовые методики сканирующей микроскопии



1 Сканирующий атомно-силовой / зондовый микроскоп



2 Вексельный сканирующий оптический микроскоп



3 Эллипсометр

Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ)

Метод (N) спектроскопии (Current mapping Tunneling Spectroscopy, CTS) Отображение распределения электростатического потенциала по поверхности образца, характеризующее локальные распределения.	Метод (I) спектроскопии Измеряет туннельный ток в зависимости от расстояния зонд-образец.
Метод постоянной высоты (Constant Height mode) Измерение рельефа поверхности при сканировании образца. При этом система поддерживает постоянную высоту туннельного тока между зондом и поверхностью.	Метод постоянной тока (Constant Current mode) Измерение рельефа поверхности при сканировании образца. При этом система обратной связи поддерживает постоянную высоту туннельного тока между зондом и поверхностью.

Метод отображения работы выхода
Определение состава поверхности образца путем постоянного измерения порогового напряжения туннельного тока при сканировании зонд-образец.

Микроволновые методики (MRF - Microwave Reflectance)

Микроволновая сканирующая микроскопия (SCM) (Scanning Tunneling Microscopy, STM) Отображает распределение электростатического потенциала по поверхности образца.	Метод зонда Кельвина (Kelvin Probe Microscopy, KPM) Измерение распределения электростатического потенциала по поверхности образца.
Сканирующая емкостная микроскопия (ECM) (Scanning Capacitance Microscopy, SCM) Отображает распределение локальной емкостной микроскопии в зависимости от частоты сканирующей системы.	Статистическая микроволновая сканирующая микроскопия (SCM) (DC Magnet, Force Microscopy, AFM) Отображает распределение магнитной структуры поверхности, связанной с локальными распределениями магнитного поля.

Динамическая магнитно-силовая микроскопия (DMFM)
(DC Magnet, Force Microscopy, AFM)

Отображает распределение магнитной структуры поверхности, связанной с локальными распределениями второй производной магнитного поля.

Бесконтактная атомно-силовая микроскопия

Бесконтактный метод AFM (Non-Contact mode) Измерение рельефа поверхности с использованием колебаний с резонансной частотой зонда. В процессе сканирования острая игла не касается поверхности образца, а обратная связь поддерживает постоянную амплитуду колебаний зонда.

Контактная сканирующая атомно-силовая микроскопия (КАСМ)

Отображение силы расщепления (Shear Force Microscopy, SFM) Отображение распределения локальной упругости по поверхности образца.	Метод модуляции силы (Force Modulation mode) Отображение распределения локальной упругости по поверхности образца.
Атомно-силовая акустическая микроскопия (ASAM) (Atomic Force Acoustic Microscopy, AFAM) Отображение распределения электростатического потенциала по поверхности образца, характеризующее локальные распределения.	КАСМ реперная статистика (AFM Reference Statistics) Отображение распределения локальной упругости по поверхности образца. В процессе сканирования острая игла не касается поверхности образца, а обратная связь поддерживает постоянную амплитуду колебаний зонда.

Прямой-контактная сканирующая атомно-силовая микроскопия

Прямой-контактный метод (Direct Contact mode) Отображение силы расщепления на входе системы обратной связи в процессе сканирования. Метод постоянной силы обеспечивает подерживание нанообъектов.	Метод отображения фазы (Phase Imaging mode) Отображение особенностей рельефа, поверхности, адгезии и упругости, определяющих фазовую задержку колебаний зонда.
--	---

Оптическая микроскопия

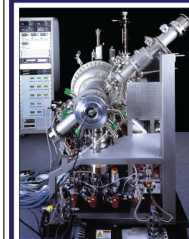
Раман-спектроскопия (Raman Spectroscopy) Метод изучения взаимодействия излучения и материи (в том числе, электромагнитного излучения, рассеяния, акустических волн, распределения по массе и энергии элементарных частиц и др.).	Спектроскопия Изучение спектров взаимодействия излучения и материи (в том числе, электромагнитного излучения, рассеяния, акустических волн, распределения по массе и энергии элементарных частиц и др.).
---	--

Электронная микроскопия

Сканирующая электронная микроскопия (Scanning Electron Microscopy, SEM) Метод анализа поверхности структуры нанообъектов путем анализа отраженного электромагнитного излучения (как правило, при специально выбранном и с помощью инфракрасного излучения, что позволяет повысить его электронную плотность и предотвратить деформацию, химическую и др. структуру).	Рентгеномископия (X-ray Microscopy) Метод исследования внутренней структуры объектов, изображения которых получают с помощью рентгеновских лучей на сканирующей (фокусированной) оптике.
---	---



4 Низкотемпературный сканирующий туннельный микроскоп



5 Система рентгенодифракционного анализа



6 Сканирующий электронный микроскоп



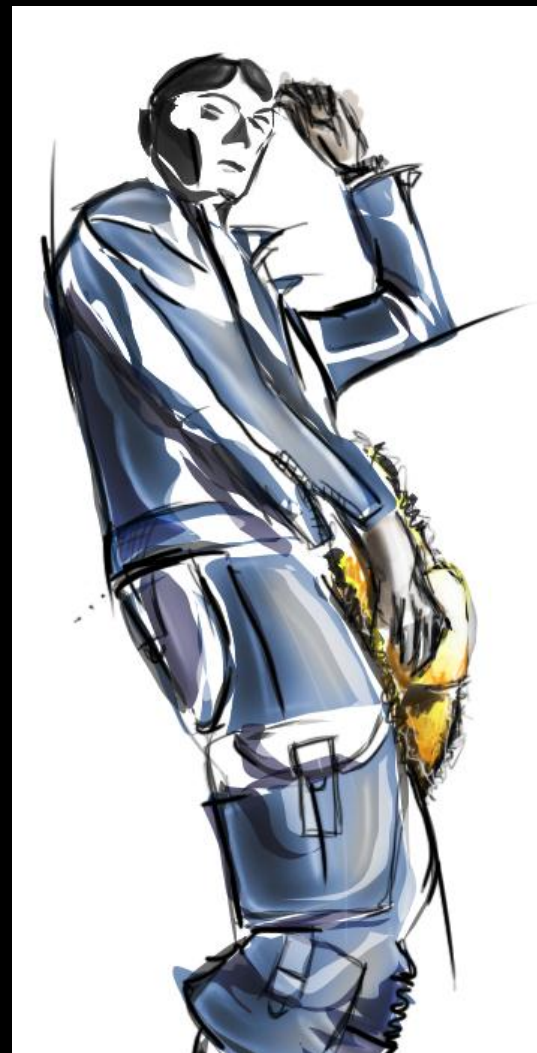
Учебно-методический комплекс
НАНОИНЖЕНЕРИЯ

nanotech.iu4.bmstu.ru



Композиция «Радость»







Эмблема «Беат-драм-шоу бестрограноф»



Миниатюра мотоцикла в масштабе 1:32



Боди-арт

